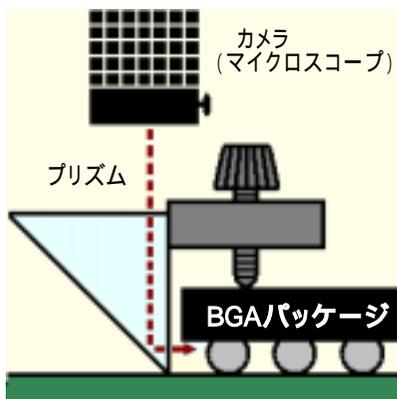


側視観察用プリズム SKL-P01

顕微鏡と併用する事を想定した安価で手軽な補助ツール。ICパッケージ下のBGAボールや、QFPリードのバックフィレット等、上方向からの画像では検査できない隙間箇所の観察が可能。

特徴

プリズムを介して、対象ワークを真横から観察できます。
面倒な調整作業が不要 手軽で安価な補助ツールです。
BGAパッケージと基板の隙間にあるハンダボールの接合部の観察に適しています。
QFPリードのバックフィレットの状態を検査するためのツールとして適しています。



プリズムを介して、横からの画像を上カメラで観察

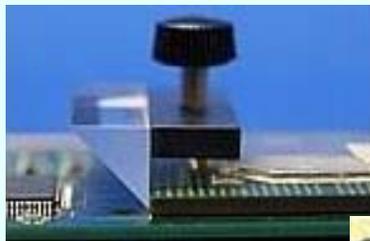
横方向から隙間を覗き込むように観察する必要があるBGAボールの検査においても、プリズムを介在させる事により、上からのカメラで、横からの画像を取得できます。



BGAボールの検査等、狭い箇所を観察する際に、補助照明が有効に機能します。



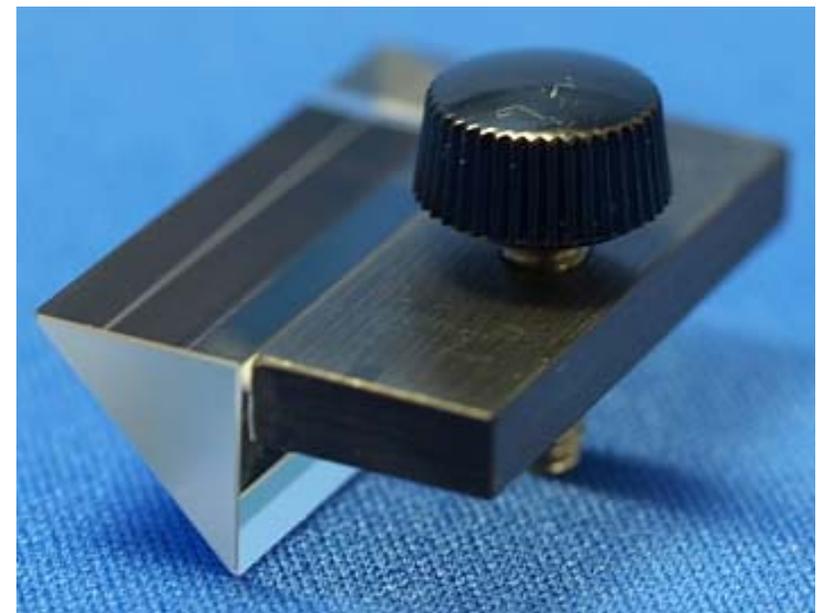
高密度実装基板にも対応できる省スペース型補助ツール



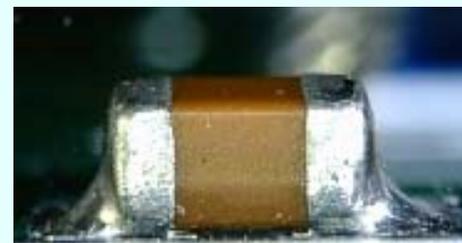
部品の端面にプリズムが接するようにセットする形になるので、周辺の部品に干渉する事なく、取り付ける事が可能です。

ノブを回す事で、パッケージをしっかりと押さえて固定します。検査中も、安定した姿勢を保つ事ができます。

製品サイズ
(W)32 × (D)10 × (H)10mm



基板上に実装された部品のハンダ接合部の検査に最適



チップ部品のハンダフィレット未ハンダ(赤目)などの不良は、通常の顕微鏡で十分に検査できますが、引け巣やクラック、オープン(剥離)などについては、横からの検査画像を取得する事で、検出率が大幅に高まります。

BGA以外のIC(QFP, SOP等)のリード部の検査にも有効に機能します。特に、通常の顕微鏡では、観察しにくいバックフィレットの詳細画像が得られる点および、オープン等の不具合が検出できる点が大きなメリットです。

